

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

Band: 65 (1974)

Heft: 5

Rubrik: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein (SEV) = Association Suisse des Electriciens (ASE)

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Informationstagung über Zuverlässigkeit von elektronischen Bauelementen und Systemen

Mittwoch, 27. März 1974 Universität Fribourg, Salle B, 1700 Fribourg

Beginn: 9.30 Uhr

Begrüssung: *H. Elsner*, Direktor, Präsident des SEV

Einführung: Prof. Dr. *W. Druey*, Tagungsleiter

A. Vorträge

1. **Aufgaben und Methoden der Zuverlässigkeitstheorie**
 - 1.1. Notations de base, fiabilité d'un dispositif
 - 1.2. Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit einfacher SystemeReferent: *A. Biorlini*, dipl. Ing. ETHZ, Institut für technische Physik, ETHZ
2. **Fehlerursachen bei schadhafte Transistoren und integrierten Schaltungen**
Referent: *F. Winiger*, dipl. Ing. ETHZ, Faselec AG, Zürich
3. **Méthodes de l'évaluation de la fiabilité des condensateurs**
Referent: *P.L. Boyer*, dipl. Physiker, Condensateurs Fribourg SA, Fribourg
4. **Ziele und Organisation des CENELEC Electronic Components Committee (CECC)**
Referent: *J. Mattli*, SEV, Zürich

B. Allgemeine Aussprache

Diskussionsleitung: Prof. Dr. *W. Druey*

C. Mittagessen

ca. 12.30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen im Restaurant Gambrinus, Hotel de Fribourg, Boulevard de Pérolles 1, Fribourg

D. Vorträge

14.15 Uhr

5. **Les travaux du Comité d'Etudes N° 56 de la CEI, Fiabilité et maintenabilité**
Referent: *P.L. Boyer*, dipl. Physiker, Condensateurs Fribourg SA, Fribourg
6. **Die Herstellung von Geräten mit garantierter Zuverlässigkeit**
Referent: *F.W. Richard*, Ing.-Techn. HTL, Autophon AG, Solothurn
7. **Die Auswirkung der Unzuverlässigkeit jeder Komponente auf die Systemzuverlässigkeit, erklärt am Beispiel der Hochspannungsgleichstromübertragung**
Referent: *H.H. Frey*, dipl. Ing. ETH, BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie, Baden

E. Pause

ca. 15.30 bis 15.45 Uhr

F. Vorträge

8. **Praktische Zuverlässigkeitsanforderungen an ein Großsystem der Nachrichtentechnik**
Referent: *K. Siuda*, dipl. El.-Ing. ETHZ, Hasler AG, Bern
9. **Produktesicherung am Beispiel von Satellitenprojekten**
Referent: *A. Thomann*, Ing.-Techn. HTL, Contraves AG, Zürich

G. Allgemeine Aussprache, Schlusswort

Diskussionsleiter: Prof. Dr. *W. Druey*

ca. 17.10 Uhr

Schluss der Tagung

(Der Städtesschnellzug Lausanne ab 16.52 hält ausnahmsweise um 17.35 Uhr in Fribourg)

H. Organisation

Tagungsort: Universität Fribourg, Salle B, 1700 Fribourg (7 Minuten vom Bahnhof SBB)

Mittagessen: Restaurant Gambrinus, Hotel de Fribourg, Boulevard de Pérolles 1, 1700 Fribourg (10 Minuten von der Universität)

Kosten: Teilnehmerkarte:
– Mitglieder des SEV: Fr. 60.–
– Nichtmitglieder: Fr. 100.–
Mittagessen inkl. Getränke und Bedienung: Fr. 23.–

Im Teilnehmerbeitrag ist die nachträgliche, kostenlose Zustellung eines Sonderdruckes, enthaltend sämtliche an der Tagung gehaltenen Referate, eingeschlossen.

I. Anmeldung

Die Interessenten an dieser Veranstaltung bitten wir, die beigelegte Anmeldekarte bis spätestens **Mittwoch, den 20. März 1974** an das Administrative Sekretariat des SEV, Seefeldstrasse 301, 8008 Zürich, zu senden.

Gleichzeitig ersuchen wir um Einzahlung der Kosten mittels des ebenfalls beigelegten Einzahlungsscheines auf das PC-Konto des SEV, Nr. 80-6133.

Nach Eingang der Anmeldungen und erfolgter Bezahlung der Kosten erfolgt der Versand der Teilnehmerkarten sowie der Bons für die bestellten Mittagessen.

Journée d'information sur Fiabilité de composants et d'équipements électroniques

Mercredi 27 mars 1974 à la salle B de l'Université de Fribourg, 1700 Fribourg

Ouverture: 9 h 30

Allocution de M. H. Elsner, directeur, président de l'ASE
Introduction de M. W. Druey, Prof., D^F, président de la journée

A. Conférences

- 1. Buts et méthodes de la théorie de la fiabilité**
 - 1.1 Notations de base, fiabilité d'un dispositif
 - 1.2 Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit einfacher SystemeConférencier: A. Birolini, ingénieur diplômé EPFZ, Institut für technische Physik, EPFZ
- 2. Fehlerursachen bei schadhafte Transistoren und integrierten Schaltungen**
Conférencier: F. Winiger, ingénieur diplômé EPFZ, Faselec SA, Zurich
- 3. Méthodes de l'évaluation de la fiabilité des condensateurs**
Conférencier: P. L. Boyer, physicien diplômé, Condensateurs Fribourg SA, Fribourg
- 4. Ziele und Organisation des CENELEC Electronic Components Committee (CECC)**
Conférencier: J. Mattli, ASE, Zurich

B. Discussion générale

Direction des débats: W. Druey, Prof., D^F

C. Déjeuner

env. 12 h 30

Déjeuner en commun au restaurant Gambrinus, Hôtel de Fribourg, Boulevard de Pérolles 1, Fribourg

D. Conférences

A 14 h 15

- 5. Les travaux du Comité d'Etude N° 56 de la CEI, Fiabilité et maintenabilité**
Conférencier: P. L. Boyer, physicien diplômé, Condensateurs Fribourg SA, Fribourg
- 6. Die Herstellung von Geräten mit garantierter Zuverlässigkeit**
Conférencier: F. W. Richard, ing.-techn. ETS, Autophone SA, Soleure
- 7. Die Auswirkung der Unzuverlässigkeit jeder Komponente auf die Systemzuverlässigkeit, erklärt am Beispiel der Hochspannungs-gleichstromübertragung**
Conférencier: H. H. Frey, ingénieur diplômé EPFZ, BBC Société Anonyme Brown, Boveri & Cie, Baden

E. Récréation

env. 15 h 30 à 15 h 45

F. Conférences

- 8. Praktische Zuverlässigkeitsanforderungen an ein Großsystem der Nachrichtentechnik**
Conférencier: K. Siuda, ingénieur diplômé EPFZ, Hasler SA, Berne
- 9. Produktesicherung am Beispiel von Satellitenprojekten**
Conférencier: A. Thomann, ing.-techn. ETS, Contraves SA, Zurich

G. Discussion générale et mot final

Direction des débats: W. Druey, Prof., D^F

env. 17 h 10

Clôture de la journée

(Le train interville, Lausanne dép. 16 h 52, s'arrête exceptionnellement à Fribourg, 17 h 35)

H. Organisation

Lieu de la manifestation: Université Fribourg, Salle B, 1700 Fribourg (7 minutes de la gare CFF)

Déjeuner en commun: Restaurant Gambrinus, Hôtel de Fribourg, Boulevard de Pérolles 1, 1700 Fribourg (10 minutes de l'Université)

Frais: Carte de participation:
pour membres de l'ASE Fr. 60.-
pour non-membres Fr. 100.-
Déjeuner en commun, boissons et service **inclus** Fr. 23.-

Quelques semaines après la manifestation, un tirage à part, contenant les conférences de la journée, sera envoyé gratuitement aux participants.

I. Inscription

Nous prions les intéressés de bien vouloir envoyer le bulletin d'inscription ci-joint au plus tard jusqu'au **mercredi, le 20 mars 1974** au Secrétariat administratif de l'ASE, Seefeldstrasse 301, 8008 Zurich, en virant simultanément les frais au moyen du bulletin de versement, également ci-joint, sur le compte de chèques postaux de l'ASE N° 80-6133.

Les participants recevront les cartes de participant, ainsi que les bons pour les déjeuners commandés après enregistrement de leur inscription et versement de leur contribution financière.